

サンビーム 発表内容

ポスター発表 9月7日(金)			
S-01	中山 耕輔	川崎重工業(株)	XAFSを用いた系統連系用大型Ni-MH電池の材料評価
S-02	瀬尾 眞浩	(株)神戸製鋼所	Ni表面にUPDLしたPb単分子層のin-situ XAFS解析
S-03	北原 周	(株)神戸製鋼所	小角散乱法による金属ナノ粒子の評価
S-04	飯原 順次	住友電気工業(株)	低環境負荷タングステンリサイクル技術開発
S-05	細井 慎	ソニー(株)	RuPtコアシェルナノ粒子のXAFS解析
S-06	越谷 直樹	ソニー(株)	有機半導体薄膜のX線回折法による構造評価
S-07	出口 博史	関西電力(株)	二酸化炭素吸収液用アルカノールアミン分子の配座解析
S-08	秋保 広幸	(一財)電力中央研究所	水溶性セレン化学種のXAFS解析
S-09	吉木 昌彦	(株)東芝	低温全反射XAFSによる絶縁薄膜の局所構造解析
S-10	浅田 崇史	(株)豊田中央研究所	放射光CTIによるパワーモジュール内部変形計測
S-11	小坂 悟	(株)豊田中央研究所	波長分散法によるPd中不純物の蛍光X線分析
S-12	宮野 宗彦	日亜化学工業(株)	二次元検出器を用いたLEDチップの残留応力評価
S-13	今井 英人	日産自動車(株)	In situ XAFSと第一原理計算によるLiイオン電池充放電挙動の解析
S-14	平岩 美央里	パナソニック(株)	InGaN単一量子井戸構造における相分離の評価
S-15	平野 辰己	(株)日立製作所	XASによるリチウム電池正極材の価数分布評価
S-16	米山 明男	(株)日立製作所	マイクロビーム走査型X線顕微鏡による肝細胞の観察
S-17	淡路 直樹	(株)富士通研究所	富士通研究所におけるSPring-8放射光の利用
S-18	土井 修一	(株)富士通研究所	微小角入射X線回折による有機薄膜太陽電池の構造評価
S-19	上原 康	三菱電機(株)	酸化亜鉛結晶薄膜のZn-K吸収端分光における偏光依存性評価
S-20	南部 英	XAFS装置SG	サンビームXAFS装置の現状
S-21	高尾 直樹	イメージングSG	サンビームにおける二次元XAFS法の検討